⑶　比吸収率を測定する測定間隔は、比吸収率の最大値を探索するための走査の場合は、３GHz以下のときは20㎜以下とし、３GHzを超えるときは60／ｆ㎜とすること。ただし、立方体走査の立方体１辺の寸法の１／２を超えないこと。内部表面近くでの走査を行う場合の電界プローブ先端の中央とファントム内部表面の間の距離は、３GHz以下のときは５㎜未満（偏差±１㎜）、３GHzを超えるときはδｌｎ（２）／２㎜未満（偏差±0.5㎜）の範囲内とすること（δは平面波の表皮深さ、ｌｎ（ｘ）はｘの自然対数とする。）。

⑷　立方体走査の場合は、測定間隔は24／ｆ㎜以下、かつ、８㎜を超えないこととし、深さ方向の測定間隔は８－ｆ㎜以下とし、かつ、５㎜を超えないこと。垂直方向の測定を等間隔ではない間隔で行う場合は、ファントム外殻に最も近い測定点とその次に近い点の間隔は12／ｆ㎜以下とし、かつ、４㎜を超えないこと。また、垂直方向以外の方向は、隣接する間隔に対して1.5倍を超えない割合で間隔を広げることができる。立方体走査における最小寸法は、３GHz以下のときは30㎜×30㎜×30㎜とし、３GHzを超えるときは最小寸法を22㎜×22㎜×22㎜とすることができる。プローブ検出部の中心とファントム内部表面との最大距離は、３GHz以下のときは５㎜、３GHzを超えるときはδｌｎ（２）／２㎜とすること。

⑸　比吸収率の測定値が最大となる座標位置が電界プローブ走査範囲の端に存在する場合は、ファントム外殻内で電界プローブの走査位置及び走査範囲を調整し、比吸収率が最大となる座標位置を探索すること。この場合において、プローブ走査装置の調整及び比吸収率測定用ソフトウエアの設定を変更することによって、装置で測定可能な範囲の限界まで電界プローブ走査範囲を拡大し、比吸収率が最大となる座標位置を探索できるように比吸収率測定装置を調整すること。

⑹　全ての測定点において、プローブの角度は、３GHz以下の場合で30°未満、３GHzを超える場合で20°未満とすること。

四　比吸収率の測定⑵　傾斜させた位置での測定

１　測定系統図

三の１に準ずる。

２　測定操作手順

⑴　試験機器の保持台への取付け

ア　図３に示すように、試験機器をファントム外殻表面に近づけ、ＲＥとＬＥを結ぶ直線上に試験機器のＡを乗せ、試験機器の垂直中央線と水平線で形成する面をファントム外殻の正中面と平行にする。

イ　試験機器をファントム外殻のＲＥとＬＥを結ぶ直線に沿って耳に接触するまでファントム外殻に近づける。

ウ　試験機器をファントム外殻のＲＥとＬＥを結ぶ直線を軸として垂直中央線が基準面（ＲＥ、ＬＥ及びMを含む平面）に平行になるまで回転する。

エ　試験機器の垂直中央線と水平線で形成する面がファントム外殻の正中面に平行になっていることを確認する。

オ　エの状態で、試験機器のＡをファントム外殻のＲＥとＬＥを結ぶ直線上に置き、耳に接触した状態を維持したまま、試験機器の直線ＮＦ（ＲＥ又はＬＥを通り基準面に垂直な直線）を軸として受話部の下の任意の一点がファントム外殻に接触するまで回転する。

カ　図４に示すように、試験機器の向きを変えずに、基準面と平行に移動し、試験機器が15°回転できるまでファントム外殻から離す。

キ　試験機器を試験機器の水平線を軸に15°回転する。

ク　試験機器の向きを変えずに、試験機器の一部がファントム外殻に接触するまで試験機器を基準面と平行に移動する。

ケ　試験機器の一部が左又は右の耳に接触していることを確認する。試験機器の一部が耳以外の場所に接触している場合は、試験機器の傾斜角を小さくして耳に接触する位置で固定し、試験機器のＡが可能な限りファントム外殻の耳に近づく位置とする。ただし、試験機器の受話部中央付近がファントム外殻の耳に接しない場合は、試験機器のＡ付近がファントム外殻の耳に接した状態で、15°未満の角度で試験機器のＢがファントム外殻の頬から最も離れる位置とする。

⑵　比吸収率の測定

三の２⑵に準ずる。ただし、試験機器の保持台への取付けについては、⑴のとおりとすること。

３　試験結果の記載方法

傾斜させた位置での各状態における比吸収率の最大値をＷ／kg単位で記載し、ファントム外殻の座標位置に対する比吸収率（測定値）の分布をグラフ等で記載すること。

４　その他の条件

三の４に準ずる。

五　比吸収率の測定⑶　比吸収率最大位置での測定

１　測定系統図

三の１に準ずる。

２　測定操作手順

⑴　試験機器の保持台への取付け

三及び四の測定結果のうち、最大の測定値が得られた取付位置（試験機器の状態を含む。以下同じ。）及び設備規則第14条の２第２項に規定する値の50％以上の全ての測定値が得られた取付位置に試験機器を固定する。

⑵　比吸収率の測定

ア　ファントム液剤を気泡が生じないように静かにかくはんする。

イ　プローブ走査装置を操作してファントム外殻内の基準点とプローブ走査装置の基準点を合わせる。

ウ　⑴の取付位置に試験機器を固定する。

エ　試験機器の送信周波数を送信周波数帯域の最大に設定して連続送信状態で送信し、比吸収率を測定する。

オ　試験機器の送信周波数を送信周波数帯域の最小に設定して連続送信状態で送信し、比吸収率を測定する。

カ　送信周波数帯域幅が中心周波数の10％を超える場合は、試験機器の送信周波数を送信周波数の任意の周波数（一の４で算出したｎに２を減じた数）に設定して連続送信状態で送信し、比吸収率を測定する。

３　試験結果の記載方法

三から五までの測定で得られた試験機器の各状態における比吸収率（測定値）の最大値をＷ／kg単位で記載すること。

また、比吸収率の最大値が得られた試験機器の状態（アンテナの伸縮状態等を含む。）及びファントム外殻の座標位置に対する比吸収率（測定値）の分布をグラフ等で記載すること。

４　その他の条件

三の４に準ずる。